# OIML R76:2006

01ML R70:2000	
3.10.4 同一型式のはかり又はモジュールの試験 各種能力及び特性の同一型式のはかり又はモジュールが型式承認試験に提出された場合、次の条項 を適用して試験(EUT)の選択を行なう。指示計については、附属書C.2を参照。	<b>3.10.4 Testing of a family of instruments or</b> Where a family of instruments or modules of various of presented for type examination, the following prov Equipment Under Test (EUT). For indicators, refer also
3.10.4.1 EUT(被試験器物)の選択 試験を行なう被試験器物(EUT)の選択は、その数を最小となるようにし、代表機種となるように選択しな ければならない(3.10.4.6の受入れ可能解決策の事例を参照)。 最も感度の高い被試験器物(EUT)を承認することによって低い感度特性をもつ、その他の機種の承認を	<b>3.10.4.1 Selection of EUTs</b> The selection of EUTs to be tested shall be such that nevertheless sufficiently representative (see examp 3.10.4.6).
包含することができる。最高の計量的特性をもつ被試験器物(EUT)を試験に選ばなければならない。	Approval of the most sensitive EUTs implies approv characteristics. Therefore, when a choice exists, metrological characteristics shall be selected for test.
3.10.4.2 試験される同一型式内のその他の機種 同一型式に対して、最大の検定目量の数(n)をもつ機種及び最小の検定目量(e)をもつ機種を少なく とも被試験器物(EUT)として選ばなければならない。さらに、被試験器物(EUT)は3.10.4.6に従って試験 が必要なときがある。選択された被試験器物(EUT)が他の機種の特性をもつ場合、被試験器物(EUT) は、一台のみでよい。	<b>3.10.4.2</b> Variants within a family to be tested For any family, at least the variant with the highes intervals (n) and the variant with the smallest verifica- selected as EUTs. Further EUTs may be required acco- has both characteristics, one EUT may be sufficient.
<ul> <li>3.10.4.3 試験を必要としないその他の機種被試験器物(EUT)以外の機種は、次の■の一つの条件に適用されるのであれば、類似の計量的特性に対して試験を省略することができる。</li> <li>ひょう量(Max)が試験された2台の被試験器物(EUT)のそれぞれのひょう量の間に入っていれば、試験せずに受入れられる。試験した各機種のひょう量の比は10を越えてはならない。</li> <li>次のa)~c)全てに適用 されなければならない。 <ul> <li>a) n ≤ ntest</li> <li>b) e ≥ etest</li> <li>c) Max ≤ 5 × Maxtest × (ntest / n)</li> <li>備考: 被試験器物(EUT)の特徴は、</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>3.10.4.3 Variants acceptable without testing Variants other than the EUTs can be accepted without bulleted provisions is fulfilled (for comparable metrolos Their capacities, Max, fall between two tested can tested capacities shall not exceed 10; or</li> <li>All of the following conditions a), b), and a) n ≤ n<sub>test</sub> b) e ≥ e<sub>test</sub> c) Max ≤ 5 × Max<sub>test</sub> × (n<sub>test</sub> / n) Note: Max<sub>test</sub>, n<sub>test</sub>, and e<sub>test</sub> are the characteristic</li> </ul>
3.10.4.4 精度等級 同一型式の被試験器物(EUT)が一つの精度等級に対して完全に試験されている場合、低い精度等 級の被試験器物(EUT)に対してはまだ行われていない部分の試験だけを行なう。	<b>3.10.4.4 Accuracy class</b> If an EUT of a family h one accuracy class, it is sufficient for an EUT of a lower carried out that are not yet covered.
3.10.4.5 考慮すべき他の特性 全ての計量に関連する特性及び機能は、適用できる限り、かつできるだけ多く、少なくとも一度は同一の 被試験器物(EUT)で試験しなければならない。	<b>3.10.4.5 Other features to be considered</b> All metrologically relevant features and functions hav an EUT as far as applicable and as many as possible i
<ul> <li>例えば、被試験器物(EUT)1台で無負荷表示の温度影響及び異なる被試験器物(EUT)での組合せ影響(表7参照)を試験することは受け入れられない。例えば、異なる計量関連特性及び機能の機種:</li> <li>○ ハウジング</li> <li>○ 荷重受け部</li> <li>○ 温度及び湿度範囲</li> <li>○ はかり機能</li> <li>○ 表示</li> <li>○ その他</li> </ul>	For example, it is not acceptable to test the temperate on one EUT and the combined effect (see Table 7) or metrologically relevant features and functions such as housings; load receptors; temperature and humidity ranges; instrument functions; indications; etc.
その特性の影響を受けるこれら因子の追加部分的試験をしなければならない。これら追加試験は同一の 被試験器物(EUT)で行なうことが望ましいが、それが不可能な場合、試験当局の責任の下で1台以上の 被試験器物(EUT)で試験を行う。	

#### or modules

capacities and characteristics is ovisions apply for selecting the lso to Annex C.2.

at their number is minimized but mple in acceptable solution of

oval of the variants with lower s, the EUTs with the highest t.

#### ed

est number of verification scale ication scale interval, *e*, shall be cording to 3.10.4.6. If a variant

ut testing, if one of the following ological characteristics): capacities. The ratio between the

and c) are fulfilled:

tics of the EUT.

has been tested completely for wer class if only partial tests are

ave to be tested at least once in e in the same EUT.

ature effect on no-load indication on a different one. Variations in as different:

ors which are influenced by that carried out on the same EUT, but al EUTs may be performed under

## **OIML R76:2006**

3.10.4.6 関連計量特性のまとめ	3.10.4.6 Summary of relevant metrological ch
被試験器物(EUT)は次の項目を包含していなければならない:	The EUTs must cover:
■ 検定目量の数の最大数(n <sub>max</sub> )	highest number of verification scale intervals,
■ 最小の検定目量(emin)	Iowest verification scale interval, emin;
■ 最小入力信号(µV/e)(アナログ歪ゲージ付ロードセル)	Iowest input signal, µV/e (when using analog s
<ul> <li>■ 全ての精度等級</li> </ul>	<ul> <li>all accuracy classes;</li> </ul>
■ 全ての使用温度範囲	<ul> <li>all temperature ranges;</li> </ul>
■ 単一目量はかり、複目量はかり又は多目量はかり	<ul> <li>single range, multiple range or multi-interval in</li> </ul>
■ 有意である場合、荷重受け部の最大サイズ	<ul> <li>maximum size of load receptor, if significant;</li> </ul>
■ 計量関連特性(3.10.4.4参照)	<ul> <li>metrologically relevant features (see 3.10.4.5)</li> </ul>
■ はかりの機能の最大数	<ul> <li>maximum number of instrument functions;</li> </ul>
■ 表示桁の最大数	<ul> <li>maximum number of indications;</li> </ul>
■ 接続される周辺装置の最大数	<ul> <li>maximum number of peripheral devices connect</li> </ul>
■ 内蔵デジタル装置の最大数	maximum number of implemented digital device
■ アナログ及びデジタル装置の最大数	maximum number of analog and digital interface
■ 指示計に接続可能な場合、複数の荷重受け部	<ul> <li>several load receptors, if connectable to the in</li> </ul>
■ 異なる形の電源(主電源及び/又は電池)	<ul> <li>different types of power supply (mains and/or</li> </ul>

ある同一型式被試験器物(EUT)の選択に対する受入れ可能な解決策:

表8 二つの同一型式をもつ非自動はかりの一型式に対すろ被試験器物(FUT)の選択

衣o 至式でもフォロ動はかりの 至式に対する彼試験品物(EUT)の選択						
同一型式1	機種	Max	е	d	п	EUT
精度等級II 級	1.1	200 g	0.01 e	0.001 g	20,000	
使用温度範囲	1.2	400 g	0.01 g	0.001 g	40,000	Х
10℃~30℃	1.3	2000 g	0.05 g	0.05 g	40,000	
同一型式2	2.1	1.5 kg	0.5 g	0.5 g	3,000	Х
	2.2	3 kg	1 g	1 g	3,000	
精度等級 III 級	2.3	5 kg	2 g	2 g	2,500	
使用温度範囲 -10℃~40℃	2.4	15 kg	5 g	5 g	3,000	Х
	2.5	60 kg	20 g	20 g	3,000	

「備考: この事例は3.10.4.2及び3.10.4.4に基づいた被試験器物(EUT)の各種能力及び計量 特性だけを対象としている。3.10.4.5に基づいたその他の計量関連特性は現実に考慮され | Not なければならず、その結果1代以上の追加被試験器物(EUT)となることがある。

選択する際の注意:

- 機種1.2、2.1及び2.4は被試験器物(EUT)として選択される(表8の最終欄に印を付けた)。
- 機種1.1は試験の必要なし。それは、機種1.2と同一の検定目量(e)及び実目量(d)をもってい るからである。ひょう量(Max)だけが200 gに低減している(3.10.4.3参照)。
- 機種1.2は同一型式1の最良の計量特性をもっていて、3.10.4.2に基づいて完全に試験しなけ ればならない。
- 機種1.3は試験の必要がない。ひょう量(Max)が機種1.2の5倍を超えていないからである (3.10.4.3参照)。
- 機種 2.1は、同一型式2の最良の計量特性、すなわち最小の検定目量(e)及び最大の検定 目量の数(n)をもっている。したがって、機種2.1は試験の必要がある(3.10.4.4参照)。精度等 級III 級に適用する試験だけを追加して行なうことで十分である。精度等級II 級及びIII 級に 機種1.2で既に行った試験を繰返す必要がない。

Acceptable solution for the selection of EUTs of a family:

Table 8 – Selection of EUTs for a type of a non-automatic weighing instrument with . two families

		100	lannies			
	Variant	Max	е	d	n	EUT
Family 1 Accuracy class II	1.1	200 g	0.01 g	0.001 g	20 000	
Temperature	1.2	400 g	0.01 g	0.001 g	40 000	Х
range: 10 °C / 30 °C	1.3	2000 g	0.05 g	0.05 g	40 000	
Family 2	2.1	1.5 kg	0.5 g	0.5 g	30 00	Х
Accuracy class	2.2	3 kg	1 g	1 g	30 00	
Temperature	2.3	5 kg	2 g	2 g	25 00	
range: - 10 °C / 40 °C	2.4	15 kg	5 g	5 g	30 00	Х
	2.5	60 kg	20 g	20 g	30 00	
e: This example covers only the various capacities and metro characteristics of the EUTs according to 3.10.4.2 to 3.10.4.4. The metrologically relevant features according to 3.10.4.5 must in practice b into account, too, and may result in one or more additional EUTs.						

Remarks on the selection:

- Variants 1.2, 2.1 and 2.4 are selected as EUTs (marked in last column of Table 8).
- Variant 1.1 needs not be tested, because it has the same e and d as variant 1.2. Only the value of Max is reduced to 200 g (see 3.10.4.3).
- Variant 1.2 has the best metrological characteristics of family 1 and shall be tested completely according to 3.10.4.2.
- Variant 1.3 needs not be tested, because Max is not more than 5 times that for variant 1.2 (see 3.10.4.3).
- Variant 2.1 has the best metrological characteristics of family 2, the smallest e

### haracteristics

;, *n*<sub>max</sub>;

strain gauge load cells);

instrument:

5);

ected; vices; faces; indicator; and different types of power supply (mains and/or batteries).

ological e other e taken

### **OIML R76:2006**

- 機種2.2及び2.3は、ひょう量(Max)が試験した機種2.1及び2.4の間にあり(3.10.4.3参照)、 その計量特性が機種2.1及び2.4未満であるか同一であるので、試験の必要がない。
- 機種2.4は、試験をしなければならない。それは機種2.5と2.1の割合が10より大きいからである (3.10.4.3参照)。機種2.4にとっては、性能試験、温度、偏置誤差、感じ、繰返し性などのいく うかの重要な追加試験を行なうことで十分である。機種1.2及び2.1に既に行った他の試験(例え ば、傾斜、電源電圧変動、高温高湿、スパン安定性、耐久性、妨害など)を繰返すことは必要で ない。
- 機種2.5は試験を行なう必要がない。それはひょう量(Max)が機種2.4の5倍以上でないからであ る(3.10.4.3参照)。

	同一型式 1	同一型式 2
精度等級	精度等級II 級	精度等級III 級
Max	1 g 2000 g	50 g 60 kg
е	0.01 g 0.2 g	0.5 g 100 g
d	0.001 g 0.2 g	0.5 g 100 g
n	$\leq$ 40 000	$\leq$ 3 000
風袋平衡範囲	100 % of Max	100 % of Max
プリセット風袋範囲	100 % of Max	100 % of Max
温度範囲	10 °C / 30 °C	-10 °C / 40 °C

表9 OIML証明書に記載される計量特件のまとめ

備考: OIML証明書はそれぞれ二つの同一型式のはかり8種を示した表8に基づいた完全な同 一型式群を包含するか、代わりに表9に従った同一型式の計量特性を包含することのいずれか である。後者の場合、同一の検定目量(e)を持つ同一のはかりであるか、表3の条件をまだ満た している場合、ひょう量(Max)を下げることができる(最小EUTとの比較で、表8)。そのOIML証 明書は表9の計量特性を満たす、その他の機種全てを対象とする。

and the greatest *n*. Therefore variant 2.1 shall be tested (see 3.10.4.4). It is sufficient to perform additionally only the applicable tests for class III. It is not necessary to repeat those tests which are the same for class II and class III and which have already been performed on variant 1.2.

- Variants 2.2 and 2.3 need not be tested, because their values of Max are in between the tested variants 2.1 and 2.4 (see 3.10.4.3) and their metrological characteristics are less than or the same as for variants 2.1 and 2.4.
- Variant 2.4 shall be tested, because the ratio between variant 2.5 and 2.1 is greater than 10 (see 3.10.4.3). For variant 2.4, it is sufficient to perform additionally some important tests such as weighing test, temperature, eccentricity, discrimination, repeatability, etc. It is normally not necessary to repeat other tests (e.g. tilting, power supply, humidity, span stability, endurance, disturbance tests) which have already been performed on variants 1.2 and 2.1.
- Variant 2.5 needs not be tested, because Max is not more than 5 times that for variant 2.4 (see 3.10.4.3).

	Family 1	Family 2
Accuracy class	II	III
Max	1 g 2000 g	50 g 60 kg
е	0.01 g 0.2 g	0.5 g 100 g
d	0.001 g 0.2 g	0.5 g 100 g
n	≤ 40 000	$\leq$ 3 000
Tare balancing range	100 % of Max	100 % of Max
Preset tare range	100 % of Max	100 % of Max
Temperature range	10 °C / 30 °C	-10 °C / 40 °C

Table 9 – Summary of the metrological characteristics presented in the OIML

Note: The respective OIML Certificate shall include either the complete family according to Table 8 with eight instruments in two families or may alternatively include the metrological characteristics of the families according to Table 9. In the latter case the Max values may be reduced (in comparison with the smallest EUT, Table 8) if it is an identical instrument with the same verification scale interval, e, and if the conditions of Table 3 are still met. The Certificate covers all variants that meet the metrological characteristics in Table 9.